

Рентгеноспектральное определение параметров горячих точек *X*-пинча

C. A. Пикуз, Д. Б. Синарс⁺, Т. А. Шелковенко, К. М. Чандлер⁺, Д. А. Хаммер⁺, И. Ю. Скобелев,
Г. В. Иваненков¹⁾*

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 117924 Москва, Россия

+Лаборатория плазменных исследований, Корнельский университет, 14853 Итака, США²⁾

** Центр спектральных данных многозарядных ионов, ВНИИФТРИ, 141570 Менделеево, Московская обл., Россия*

Поступила в редакцию 6 сентября 2002 г.

По данным рентгеновской спектроскопии определяются параметры плазмы “горячих точек” *X*-пинча. Используются данные, полученные с временным разрешением в эксперименте по взрыву перекрещенных Ti проволочек на установке *XP* с током 480 кА при длительности импульса 100 нс. Рассчитанные по ним плотности и температуры электронов лежат в диапазонах $(0.8\text{--}3) \cdot 10^{23}$ см⁻³ и 1–2.5 кэВ. Проведенный анализ свидетельствует о высокой степени неравновесности процессов в плазме.

PACS: 52.35.Ry

Измерение параметров горячей точки (ГТ) *X*-пинча все еще остается трудной задачей, требующей современной прецизионной аппаратуры. Последние эксперименты [1–5] свидетельствуют о том, что вблизи состояния наибольшего сжатия параметры плазмы меняются в пикосекундных временных и микронных пространственных масштабах. Теоретические оценки и численное моделирование предсказывают плотности плазмы выше твердого тела и температуры кэВ-диапазона [2, 4, 5]. Единственным источником данных о плазме с такими параметрами может служить рентгеновская спектроскопия. Ясно, однако, что методы, основанные на регистрации спектров интегрально по времени, даже с высоким пространственным разрешением дают сильно усредненные или искаженные данные. В настоящей работе параметры плазмы определяются по спектрам с временным разрешением. Их регистрация осуществлена по светосильной бесщелевой схеме с помощью рентгеновской стрик-камеры и фокусирующего сферически изогнутого кристалла (рис.1).

Эксперименты проводились на установке *XP* Корнельского университета (США) с током до 480 кА и длительностью импульса 100 нс. *X*-пинчи создавались во взрывах 2–8 перекрещенных проволочек из различных металлов [1, 4, 6]. Рентгеновское излуче-

ние плазмы разлагалось в спектр с помощью сферически изогнутого кристалла слюды с радиусом кривизны 150 или 186 мм и фокусировалось на фотокатод стрик-камеры в виде узкой полоски (рис.1). Ее ширина < 30–50 мкм определялась размером источника излучения, оптически уменьшенным в 5–7 раз, и качеством кристалла. Диаметр источника, согласно нашим ранним измерениям, не превышал, самое худшее, несколько десятков мкм, а качество кристалла обеспечивало фокусировку ≈ 10–20 мкм. Электростатическая система стрик-камеры размывала изображение полоски на выходном экране до ≈ 120 мкм, обеспечивая временное разрешение системы до 7–10 пс, что близко к паспортным данным используемой камеры фирмы Kentech. Подробнее детали описаны в статье [4]. Изображение временной развертки спектра регистрировалось на фотопленку Kodak TMAX400 шириной 60 мм, прижатую к стекловолоконному выходу экрана камеры. Полученное фото оцифровывалось с помощью планшетного сканера Agfa Arcus II, затем оно корректировалось с учетом геометрических искажений камеры, чувствительности фотопленки и передаточной характеристики сканера, после чего подвергалось дальнейшей обработке. В настоящей статье приведены результаты обработки данных эксперимента с 7-проводочной Ti нагрузкой с диаметром отдельных нитей 17 мкм.

На рис.2 приведены временные зависимости свечения плазмы в интервалах длин волн 2.615–2.624, 2.629–2.638, 2.642–2.651, 2.489–2.498 и 2.500–2.509 Å. Диапазоны спектра выбирались так, чтобы получить ход интенсивности соответственно: 1) резонансной

¹⁾e-mail: ivanenk@sci.lebedev.ru

²⁾D.B. Sinars, K.M. Chandler, D.A. Hammer. Laboratory of Plasma Study, 369 Upson Hall Cornell University, Ithaca NY 14853, USA.

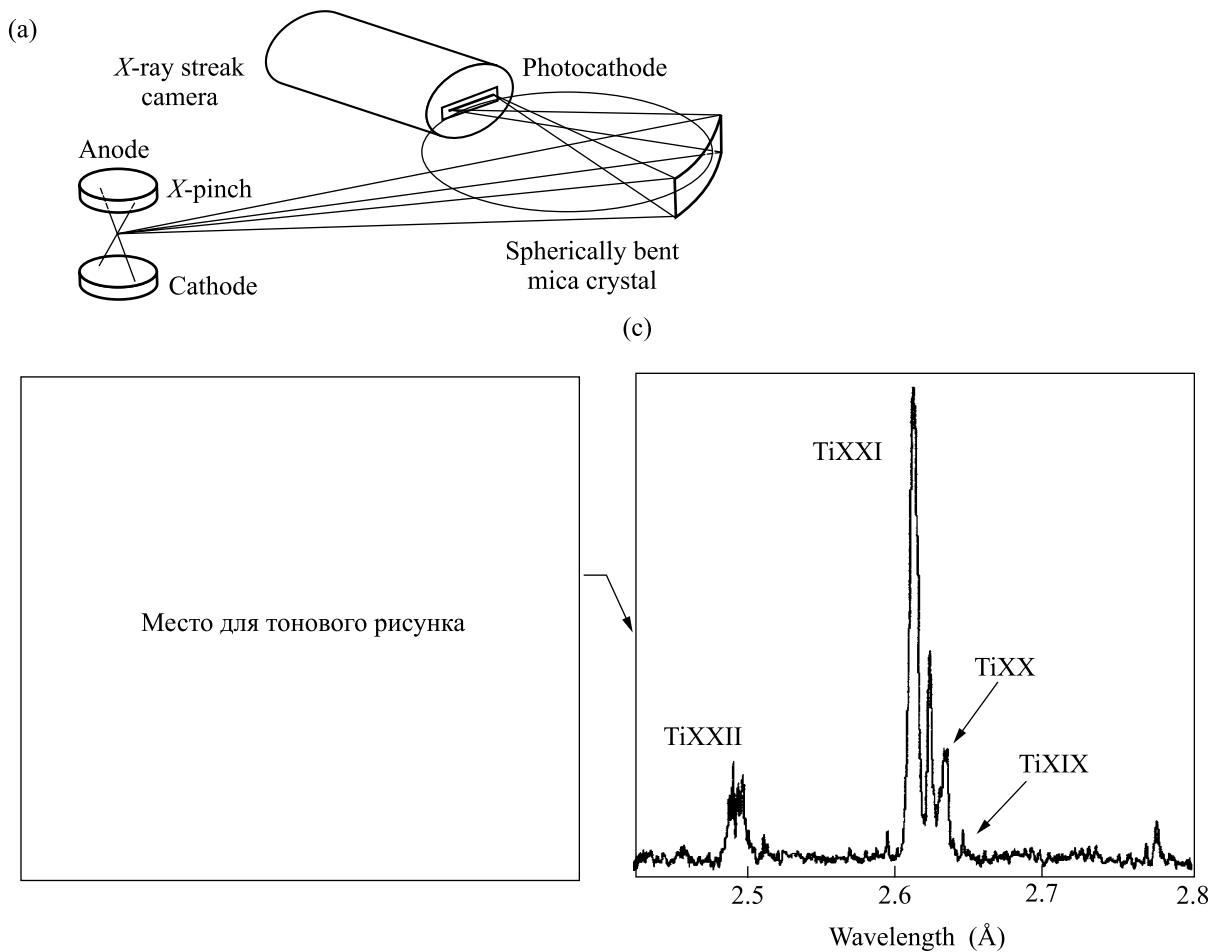


Рис.1. Схема эксперимента и зарегистрированная по ней денситограмма времяразрешенного спектра излучения Ti X-пинча

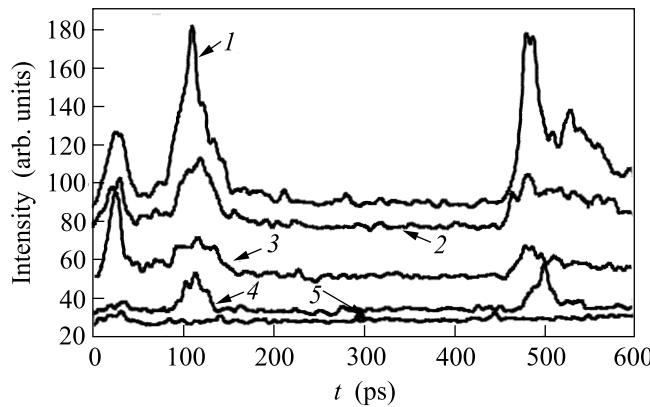


Рис.2. Временные зависимости свечения плазмы X-пинча в спектральных диапазонах 2.615–2.624 (кривая 1), 2.629–2.638 (2), 2.642–2.651 (3), 2.489–2.498 (4) и 2.500–2.509 (5) Å

линиях $\text{He}_{\alpha 1}$ Не-подобного иона Ti XXI, 2) интеркомбинационной линии $\text{He}_{\alpha 2}$ иона Ti XXI, 3) сателлит-

тов k, j (переходов $1s2p^2D - 1s^22p^2P$ в ионе Ti XX), 4) резонансной линии Ly_α H-подобного иона Ti XXII и 5) переходов в континууме. Из рисунка видно, что в интервале времен 0–600 пс светимость плазмы имеет три пика, которые естественно связать со вспышкой трех ГТ в процессе пинчевания разряда. Наиболее короткое время свечения ≈ 50 пс первой вспышки, для второй в линии Ly_α оно составляет также ≈ 50 пс, но для линий $\text{He}_{\alpha 1,2}$ это время существенно больше (≈ 80 пс). Время третьей вспышки в линии $\text{He}_{\alpha 1,2}$ составляет ≈ 110 пс, тогда как длительность свечения в линии Ly_α и сателлитах k, j по-прежнему остается ≈ 50 пс.

Различие найденных времен свечения вызвано спецификой возбуждения в плазме резонансных и сателлитных линий [H]- и [He]-ионов. Их уровни $2p$ и $1s2p$ могут заселяться при возбуждении основных состояний таких ионов $1s$ и $1s^2$ ударом электронов либо тройной или радиационной рекомбинацией гольых ядер или H-подобных ионов. Дважды возбуж-

денные состояния $1s2p^2$ заселяются, в основном, при дияэлектронном захвате из основного состояния $1s^2$ Не-подобного иона. Важно, что такой механизм понижения заряда ионов, в отличие от иных видов рекомбинации, берет энергию у свободных электронов и требует достаточного нагрева. Остыивание плазмы при распаде ГТ резко снижает эффективность возбуждения ударом и дияэлектронного захвата – каналов заселения уровней ионов с передачей энергии свободных электронов связанным. Фактически захват есть единственный путь появления сателлитов k, j и длительность свечения этих линий выражает время существования высокотемпературной плазмы. Тем самым оценивается время жизни ГТ, и у нас оно ≈ 50 пс. Напротив, резонансные состояния охлаждющейся плазмы довольно эффективно могут быть заселены тройной и радиационной рекомбинацией, так как их вероятности растут с понижением температуры. Поэтому, если в плазме имеется достаточно голых ядер (Н-подобных ионов), длительность свечения линии Ly_α ($He_{\alpha 1,2}$) превысит время сохранения высокой температуры. В условиях нашего эксперимента в плазме ГТ, по-видимому, не было голых ядер Ti, а заметное количество Н-подобных ионов Ti XXII нарабатывалось лишь во второй и третьей ГТ (рис.2, кривая 4). Поэтому не было и рекомбинационного возбуждения линии Ly_α , и время ее свечения служило также и временем жизни ГТ. В первой ГТ нехватка [Н]-ионов Ti XXII запретила этот путь возбуждения также и для линий $He_{\alpha 1,2}$. Во второй же и в третьей ГТ [Н]-ионы Ti составляли $\approx 30\%$ и $\approx 45\%$, соответственно, и рекомбинационное возбуждение на 30–60 пс затягивало задние фронты импульсов свечения плазмы в линиях $He_{\alpha 1,2}$ (рис.2, кривые 1 и 2). Отметим, что подобный эффект в пространственном распределении светимости разлетающейся лазерной плазмы в линиях [Не]-иона Mg XI ранее наблюдался в [7].

Приведенные на рис.1 спектры излучения X-пинча позволили найти параметры плазмы ГТ в разные моменты времени. Для этого по стандартной квазистационарной модели радиационно-столкновительной кинетики рассчитывался спектр излучения [Не]-иона Ti XXI с дияэлектронными сателлитами, отвечающими переходам в Li-подобном Ti XX. Для достаточно горячей плазмы модельный спектр зависит только от плотности N_e и температуры T_e электронов, они находились путем подгонки модельных спектров под наблюдения. Как и ожидалось, самым чувствительным к плотности плазмы было отношение интенсивностей линий $He_{\alpha 1}$ и $He_{\alpha 2}$, а изменение температуры наиболее сказывалось на соотношении сателли-

тов k, j . Найденные результаты приведены в таблице, а качество моделирования демонстрирует рис.3, где показаны экспериментальный спектр в момент

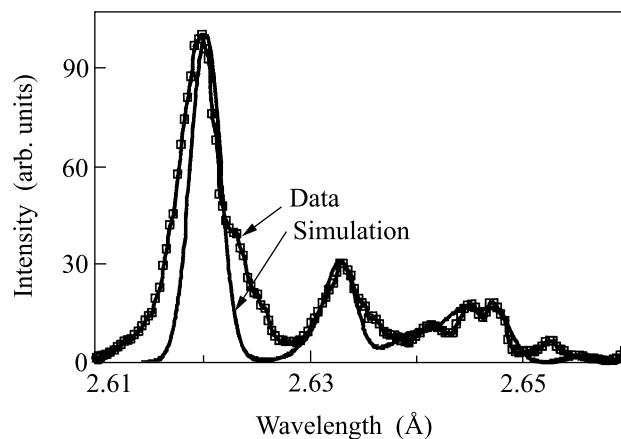


Рис.3. Спектр излучения плазмы X-пинча в момент времени $t = 494$ пс и результат расчета для $N_e = 10^{23} \text{ см}^{-3}$ и $T_e = 2.4 \text{ кэВ}$

$t = 494$ пс и результат счета для $N_e = 10^{23} \text{ см}^{-3}$ и $T_e = 2400 \text{ эВ}$. Как видно из таблицы, в первой ГТ температура плазмы не превышает величины 1250 эВ, а максимальное значение электронной плотности равно $3 \cdot 10^{23} \text{ см}^{-3}$. Во второй ГТ плазма нагрета до 2100 эВ, но ее плотность $0.8 \cdot 10^{23} \text{ см}^{-3}$ в несколько раз ниже. Максимальная температура 2500 эВ реализуется в третьей ГТ при плотности 10^{23} см^{-3} .

Номер вспышки	t (ps)	T_e (кеВ)	N_e (см^{-3})
1	32	1.25	$3 \cdot 10^{23}$
	88	1.70	10^{23}
	95	1.75	$8 \cdot 10^{22}$
	102	2.10	$8 \cdot 10^{22}$
	109	2.10	$6 \cdot 10^{22}$
	116	1.65	$2 \cdot 10^{22}$
	123	1.4	$< 10^{22}$
	130	1.15	$< 10^{22}$
2	480	1.5	$5 \cdot 10^{22}$
	487	2	$6 \cdot 10^{22}$
	494	2.4	10^{23}
	501	2.5	10^{23}
	508	2.4	$9 \cdot 10^{22}$

Если бы плазма была в стационарном ионизационном состоянии, отношение концентраций [Н]- и [Не]-ионов Ti в первой ГТ составило бы ≈ 0.07 , ≈ 0.9 – во второй и ≈ 2 – в третьей. Для температур ≥ 1 кэВ скорости возбуждения уровней $2p^2P$ и $1s2p^1P_1$ электронным ударом из основных состоя-

ний почти одинаковы [8], но тогда таковыми должны были бы быть и отношения интенсивностей линий Ly_α и $\text{He}_{\alpha 1}$. Однако на рис.2 видно, что интенсивность линии Ly_α гораздо ниже ее стационарного значения, а свечение плазмы в линии Ly_α немножко запаздывает относительно импульса свечения в линиях $\text{He}_{\alpha 1,2}$. Как было показано в [5], это вызвано неприменимостью стационарной кинетической модели для описания эволюции ионизационного состояния плазмы X -пинча. Действительно, анализ скоростей ионизационно-рекомбинационных процессов показывает, что время достижения стационарной концентрации $[\text{H}]$ -ионов Ti XXII при параметрах плазмы, приведенных в таблице, составляет ≈ 20 – 50 пс, а это сравнимо со временем существования ГТ. В этом случае для определения относительной концентрации $[\text{H}]$ -ионов следует исходить из нестационарного кинетического уравнения

$$\begin{aligned} dN_{\text{H}}/dt = -N_{\text{H}}(W_{\text{H} \rightarrow \text{Z}*} + W_{\text{H} \rightarrow \text{He}}) + \\ + N_{\text{He}}W_{\text{He} \rightarrow \text{H}} + N_{\text{Z}*}W_{\text{Z}* \rightarrow \text{H}}, \end{aligned}$$

где $N_{\text{Z}*}$, N_{H} , N_{He} – концентрации ядер H- и He-подобных ионов, соответственно, а $W_{a \rightarrow b}$ – вероятности процессов ионизации и рекомбинации. Для второй и третьей ГТ решение этого уравнения было использовано для построения временного хода отношения интенсивностей $I(\text{H})/I(\text{He})$ линий Ly_α и $\text{He}_{\alpha 1}$. Оно приведено на рис.4 вместе с экспериментальными данными. Как видно отсюда, моделирование хорошо описывает наблюдаемые зависимости, подтверждая правильность определения параметров плазмы.

Чем характерна динамика плазмы в таком состоянии? Множество полученных ранее данных [1–5] позволяет выделить медленную и быструю гидродинамические стадии сжатия X -пинча. В них обеих движение идет со скоростью звука $c_s = (ZT_e/m_i)^{1/2}$, но типичное время – отношение радиуса a к c_s – в быстрой стадии становится короче времени энергообмена между электронами и ионами $\tau_{ei} = m_i T_e^{3/2} / (2\pi m_e)^{1/2} e^4 \Lambda Z^2 N_e$. Тогда в ходе ускоренной магнитной имплозии электроны не успевают передать весь избыток тепла ионам. Остаток идет на иные процессы, в том числе – кратную ионизацию и возбуждение ионов; позже излучение интенсифицирует сжатие плазмы. Поэтому время температурной релаксации $\tau_{ei} = a/c_s$ в фазе перехода от первой стадии ко второй, а далее его можно принять в качестве оценки сверху времени быстрой стадии. На экспериментальных снимках фаза перехода отмечена существованием перетяжки диаметром около 10 мкм. Параметры плазмы $N_e = 10^{21}$ – 10^{22} см $^{-3}$,

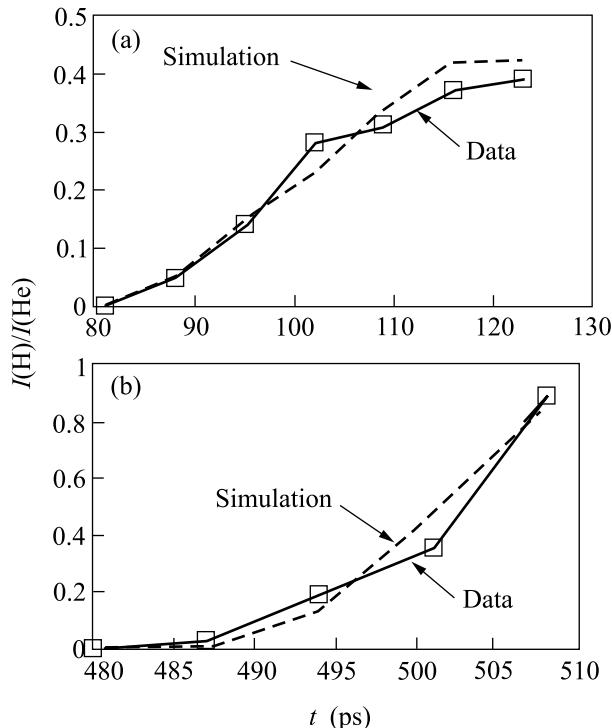


Рис.4. Наблюдаемые и рассчитанные временные зависимости отношения интенсивностей $I(\text{H})/I(\text{He})$ линий Ly_α и $\text{He}_{\alpha 1}$

$T_e = 100$ – 200 эВ ее наружной части еще не допускают термического возбуждения линий в наблюдаемой части спектра, но они вплотную подводят нас к выполнению условия $a = c_s \tau_{ei}$, где $c_s = (4–6) \cdot 10^6$ см/с, $\tau_{ei} = 40$ – 90 пс. Затем основная часть перетяжки медленно эволюционирует, а на фоне нее локально развивается быстрая мелкомасштабная неустойчивость. Она рождает перетяжки следующего порядка, на них в свою очередь образуются еще меньшие новые и т.д. – каскадирование [9]. Можно предположить, что в конце последнего и наблюдается излучение непрерывного спектра в начале рентгеновского импульса на рис.1. Это всегда ассоциируется с областью минимального размера, измерение которого пока выходит за пределы возможностей эксперимента. Во всяком случае, он < 1 – 2 мкм [5, 6] (радиографические изображения показывают минимальные диаметры 3–4 мкм). Температура излучения не очень высока, ее оценки по измерениям методом фильтров дают ≤ 1 кэВ для Ti X -пинча, для более тяжелых металлов – 600–800 эВ, а в спектре Mo X -пинча первые несколько пикосекунд линии многозарядных ионов вообще отсутствуют [5]. В спектре исследуемого Ti X -пинча непрерывное излучение возникает в первой вспышке рентгена (рис.1), причем его спектральная яркость сравнима с линейчатым излучением много-

зарядных ионов Ti, а суммарная энергия существенно выше высвечиваемой в линиях.

На основании параметров плазмы, найденных в данной работе, получим, что время термализации $\tau_{ei} \approx 3$ пс в первой ГТ и ≈ 25 пс в двух других. Подставив $c_s \approx 10^7$ см/с, отсюда оценим соответствующие размеры ГТ ≈ 0.4 и ≈ 6 мкм. Заметим, что о радиационном сжатии плазмы можно говорить с момента, когда радиус сравнивается со средним по Планку пробегом фотонов. При этом из-за того, что правая часть условия $a < c_s \tau_{ei}$ есть отношение электронного коэффициента диффузии тепла к c_s и на всей быстрой стадии сжатия возникает равномерное распределение T_e в сечении образующейся шейки, излучение становится основным механизмом ее охлаждения. Ближе к этому оказывается первая ГТ (ее плазма сжата в большей мере, чем нагрета), но здесь мало H-подобных ионов Ti, достаточно имеющихся в двух других. Поэтому можно вести речь лишь о возникновении тенденции к радиационному сжатию плазмы в нашем эксперименте с Ti X-пинчем.

Вся совокупность экспериментальных данных и теоретических оценок свидетельствует о том, что физическое явление, известное в интегральных измерениях как “горячая точка”, реально связано с чередой ряда быстро сменяющихся состояний плазмы. Если ограничиться лишь фазами генерации не очень жесткого рентгена < 10 кэВ, можно выделить два типа. Параметры первого из них с короткоживущей, относительно холодной и плотной плазмой пока мало известны и могут быть только оценены. Более или менее достоверно измерена верхняя граница времени жизни $< 10-15$ пс. Температура T_e , как упо-

миналось, не превышает 1 кэВ, а N_e по энергетическим оценкам может на 1–2 порядка превысить плотность твердого тела. Второй тип ГТ, являющийся основным предметом настоящего исследования, характеризуется более умеренными параметрами (время жизни 20–50 пс, температура 1.2–2.5 кэВ, плотность $\approx 10^{23}$ см $^{-3}$). Изучение процессов формирования первого состояния и его перехода во второе требует постановки специальных экспериментов.

Работа выполнена при поддержке грантами Департамента энергетики США # DE-FG03-98DP00217 и # DE-FO2-98ER54496.

1. T. A. Shelkovenko, D. B. Sinars, S. A. Pikuz, and D. A. Hammer, Phys. Plasma **8**, 1305 (2001).
2. S. A. Pikuz, T. A. Shelkovenko, D. B. Sinars et al., JQSRT **71**, 581 (2001).
3. D. B. Sinars, S. A. Pikuz, T. A. Shelkovenko et al., Rev. Sci. Inst. **73**, 2948 (2001).
4. T. A. Shelkovenko, S. A. Pikuz, D. B. Sinars et al., Phys. Plasma **9**, 2165 (2002).
5. S. A. Pikuz, D. B. Sinars, T. A. Shelkovenko et al., Phys. Rev. Lett. **89**, 035003 (2002).
6. T. A. Shelkovenko, D. B. Sinars, S. A. Pikuz et al., Rev. Sci. Instr. **72**, 667 (2001).
7. В. А. Бойко, Б. А. Брюнеткин, Б. Н. Дуванов и др., Письма в ЖТФ **7**, 1430 (1981).
8. Л. А. Вайнштейн, И. И. Собельман, Е. А. Юков, *Возбуждение атомов и уширение спектральных линий*, М.: Наука, 1978.
9. Г. В. Иваненков, С. А. Пикуз, Т. А. Шелковенко и др., ЖЭТФ **118**, 539 (2000).